

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физические основы технологии полупроводниковых прибо ров и интегральных микросхем»

по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»

(бакалавриат)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

<u> Цели освоения дисциплины</u>:

- формирование целостной системы знаний в области производства дискретных полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (ИМС);
- формирование у студентов навыков проведения учебных и научных экспериментов;
- формирование комплексных профессиональных и общекультурных компетенций в сфере профессиональной и научно-исследовательской деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- формирование у студентов теоретических и практических знаний, умений и навыков, необходимых при разработке, исследовании и анализе дискретных полупроводниковых приборов и ИМС.
 - формирование у студентов определенных навыков экспериментальной работы;
 - освоение методов научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативная дисциплина «Физические основы технологии полупровод никовых приборов и интегральных микросхем» относится к вариативной части цикла подготовки бакалавров по направлению 22.03.01 «Материаловедение и техноло гии материалов», в котором изучаются физические и физико-химические процессы, основе современных тонкопленочных, оптоэлектронных дискретных лежащие и интегральных полупроводниковых технологий. Изучаются различные спосо легирования автоэпитаксиальных и гетероэпитаксиальных полу бы роста проводниковых плёнок, технология формирования методами литографии топологических рисунков на фотошаблонах и полупроводниковых пластинах. Рассматриваются методы электрической изоляции активных и пассивных элементов интегральных схем, при меры технологического процесса производства биполярных интегральных микросхем, МДП-структур и ИМС на их основе, процессы сборки и контроля качества полупроводни ковых приборов и ИМС

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:

- ПЭ Материаловедение полупроводников и диэлектриков
- ПЭ Материаловедение в микроэлектронике
- Научно-исследовательская работа

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для государственной итоговой аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

к с индикаторами	
достижения компетенций	
сталлических плёнок; полупроводников на ие способы нанесения одниковые пластины; вления дискретных П-структур и ИМС на полупроводниковых научный эксперимент, исследовательскую еперимента; уверенно пьно-измерительными тером; пользоваться еменных технологий, и микротехнологии, огии; пользоваться анализа и синтеза научной обработки Опытом оформления рабочих журналов, прут или проводимые актического решения огического маршрута и ИМС в рамках никами информации,	
на питем и оп а а а а а а а а а а а а а а а а а а	

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

5. Образовательные технологии

В ходе изучения дисциплины используются традиционные методы и формы

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, семинарские и лабораторные занятия, самостоятельная работа).

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины); подготовка к тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.

6. Контроль успеваемости

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: тестирование, устный опрос.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.